i-TEM 软件测量 TEM 高分辨像的晶面间距

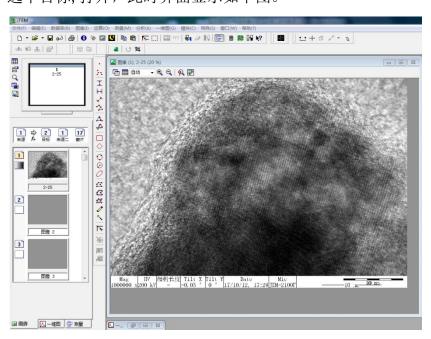
▶ 泰靖 关波

(分析测试中心电镜组 Tel: 010-62588935 Email: guanbo@iccas.ac.cn)

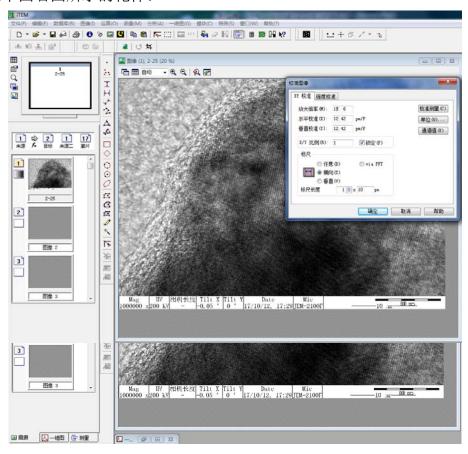
在透射电镜中,电子束穿透晶体样品后,携带了样品的结构信息,再经过物镜聚焦,在物镜后焦面上形成衍射花样,由于透射束与衍射束相互干涉,最终在物镜像平面形成的相位衬度显微图像,即高分辨电子显微像。高分辨像也称为晶格像,能够直观地给出晶面的排列信息,在晶体材料研究中具有非常重要的作用。

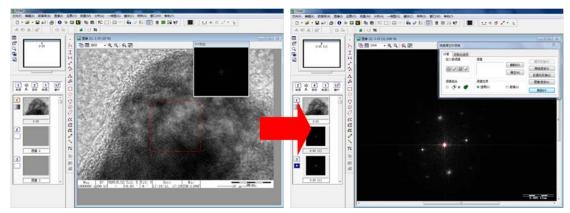
在分析高分辨像时,最重要的一个工作是尽可能准确地测量晶面间距,一般可采用直接依据标尺测量多个晶面间距再平均的方法,但是由于晶面间距较小(通常在 0.1-2nm),这种测量方法误差较大,尤其是有机晶体的高分辨像往往没有较清晰的面积比较大的区域,直接测量的误差就更大。利用高分辨像的快速傅立叶变换(FFT)谱图对晶面间距进行测量可大大提高准确性,很多软件都可以对图像进行快速傅立叶变换,透射电镜的 CCD 相机软件都具有 FFT 的功能,下面介绍利用电镜室的透射电镜所配的 CCD 软件 i-TEM 进行高分辨晶面间距测量的方法:

1、打开软件 i-TEM,单击菜单栏"文件",下拉菜单中单击"打开",弹出对话框中选中目标,打开,此时界面显示如下图。

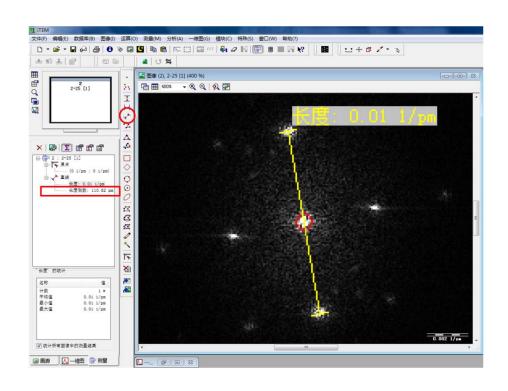


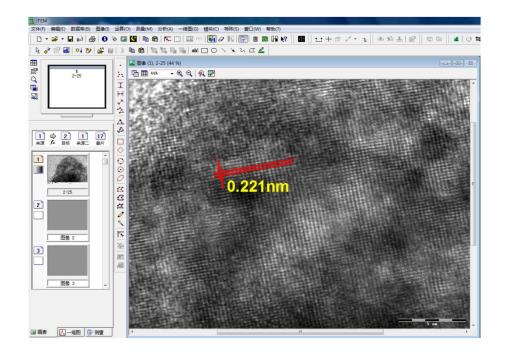
- 2、确认打开的图片是否可以进行 FFT 变换:单击菜单栏"运算",下拉菜单中选择"快速傅立叶变换",在下一级菜单中单击"FFT",弹出下图所示对话框,若"傅式变换"选项显示为如下图所示蓝色状态,即可以选择区域进行 FFT 处理;若"傅式变换"选项显示为灰色不可选择状态,表示图像不可进行 FFT 处理。此时,需要对图片进行处理:选中图片,单击菜单栏"运算",下拉菜单中选择"分离色彩",在下一级菜单栏中单击"亮度"选项,此时处理过后的图片就可以进行 FFT 处理;
- 3、检查图片的标尺是否正确: 若图像为. jpj, bmp 等格式,软件不能识别标尺,造成标尺不正确,则需对图片进行标尺校准。选中图片,单击菜单栏"图像",下拉菜单中单击"校准图像",弹出下图所示对话框,选择正确的标尺长度和单位,点击"确定",然后点击对话框中的校准测量,对图片中的标尺进行校准。校准测量时,为确保标尺的精确度,可以将图片放大后再进行校准测量。
- 4、FFT 处理:菜单栏选择"运算-快速傅立叶变换-FFT-傅式变换",弹出红色方框,选择需要变换的区域,单击鼠标右键即可对选中的区域进行 FFT 处理,得到如下图右图所示的花样。





- 5、测量晶面间距:每一个斑点到中心点的距离就是与其垂直晶面的晶面间距,为了减小测量误差,我们选择测量关于中心点对称的两个斑点的距离,同时为确保测量的精确度,需要将图片放大后再进行测量,点击工具栏中的"任意距离"选项(图中红色圆圈所示),点击关于中心透射斑对称的两个斑点的中心位置,点击软件界面左下方"测量"选项,即可显示测量距离(长度倒数,即图中红色方框所示),然后用这个数值乘以 2,即为晶面间距。
- 6、在高分辨图中进行晶面间距的标定:在高分辨像中找出与 FFT 中所测量的斑点直线垂直的晶格条纹,标出该晶面并输入晶面间距值。





致谢

感谢分析测试中心丁丽萍老师对稿件的多次审读和编辑加工!